Adaptive TFM (ATFM) 法を用いた溶接余盛上における 超音波探傷法の適用検討

川崎 拓^{*1} Kawasaki Hiraku

溶接線に対して直交方向に進展するきずを検出するため、フレキシブルウェッジを用いた溶接部の余盛 上からの超音波探傷を検討した。超音波取得方法に FMC 法を、探傷画像の構築に Adaptive TFM 法を採用 することにより、溶接部のきずに対して超音波を集束させることで探傷が可能であることがわかった。

キーワード:超音波探傷、Full Matrix Capture、FMC、Total Focusing Method、TFM、ATFM 法、 フレキシブルウェッジ

1. はじめに

超音波探傷技術は、継手溶接内部を非破壊で検 査する手法として広く用いられる。当社では、超 音波フェーズドアレイ探傷(UPA:Ultrasonic Phased Array)技術をはじめ、高精度な検査技術を開発 し、各種配管の検査工事へ適用している⁽¹⁾⁽²⁾。配 管の継手で検査対象となるきずは、溶接線に対し て平行方向に進展するきずが主であるため、溶接 部近傍の母材表面から超音波を入射する斜角探傷 法を主体として開発してきた⁽³⁾。

一方、溶接線に対して直交方向に進展するきず を検出するためには、溶接線に対して平行方向に 超音波を入射する必要があり、溶接線上から超音 波を入射することが望ましい。しかしその場合、 探触子の倣い性を確保するため、溶接余盛の研削 作業などに時間を要することが多い。溶接余盛を 研削せずに検査が可能であれば、検査作業の効率 化が期待できる。 一般的に超音波探傷では、アクリル等を遅延材 (ウェッジ)として用いる。しかし、凹凸を有する 面での探傷には表面形状に合わせて変形するフレ キシブルな遅延材(フレキシブルウェッジ)が必要 となる。フレキシブルウェッジを適用した場合、 探傷走査ごとに、探触子と試験体表面の距離や角 度が変化するため、UPA 法のように任意の点に フォーカスを設定する方法は適用できない。この 課題を解決するため、新たな超音波波形処理技術 である FMC/TFM(Full Matrix Capture/Total Focusing Method)法を用いた、Adaptive TFM 法(以下、ATFM 法)が提案されている⁽⁴⁾⁽⁵⁾。ここでは、本手法を用 いた余盛上探傷の可能性を調査した結果を報告す る。

2. ATFM 法

従来の UPA 法は、複数の振動素子をアレイ状に 並べ、個々の素子の振動タイミングを電気的に制 御しながら送受信することで、超音波ビームを任

*1:元研究開発センター 研究開発グループ (現株式会社 IHI インフラ建設 鉄鋼事業部 鉄鋼管理部 DX 開発グループ)

意の方向に偏向、集束、連続的に移動させて探傷 する技術である。一方、FMC/TFM は、アレイ状 に並べた複数の素子を1つずつ個別に振動させ データを取り、各素子の個別データを解析的に合 成する技術である。解析時に合成条件を決めるこ とができるため、より精緻な探傷画像を得ること ができる。

今回は、表面形状に合わせて変形するフレキシ ブルウェッジを試行した。この場合、探傷走査ご とに探触子の角度や試験体表面までの距離が変化 する。そこで、FMC/TFM 法の特性を活かし、ま ず試験体表面の形状と距離を把握し、その後、合 成計算を補正する。それにより表面形状の影響が 少ない探傷画像を得ることができる。

本研究では、FMC/TFM の探傷装置として AOS (エーオーエス / アメリカ) 社製 OEM-PA を使用し た。

3. 試験体

使用した溶接継手を有する試験体を図1(a)に 示す。配管を模擬し、溶接方向に約300mmのRが ついており、板厚は50mmである。図中赤線位置



(a) 試験体写真

の裏面、溶接部近傍に4カ所(①~④)、母材部に 4カ所(①'~④')の計8カ所にEDM ノッチを付与 した。溶接部近傍のノッチ①②は図1(b)に示す ように溶接部の中心に、ノッチ③④は図1(c)に 示すように溶接部横のシーニングに付与した。 ノッチの寸法は、幅1.0mm、長さ5.0mm、ノッチ 高さは①③①'③'は2.0mm、②④②'④'は4.0mmと した。座標軸は、溶接線に対して平行方向をX、 直行方向をY、板厚方向をZとする。

4. 水浸探傷試験を用いた ATFM 法の基礎的な 特性調査

4.1 試験概要

ATFM 法の基礎的な特性を調査するため、水浸 超音波探傷法を用いて、探触子の傾きや探触子と 試験体の距離が固定された状態におけるきず検出 性を確認した。

図2(a)に示すように、試験体を水槽内に設置 し、XY ステージに探触子を固定した。探触子は 3MHz、128素子のリニアアレイ探触子を使用し、 探触子中心と試験体表面の距離(水距離)はおよそ 20mmに固定した。

探触子は、長手方向を溶接線と平行にセットし



(c) ノッチ③'、④'、③、④付与位置

図1 試験体概要



(a) 探傷時の写真



図 2 水浸探傷概要

た。試験体は**図2(b)**に示すように X 方向に R が ついており、探触子表面から試験体表面までの距 離は、各素子によって異なる。

TFM における画像化範囲は、探触子の直下 X 方 向に 100mm、Z 方向に 80mm とした。この時、水 距離が 20mm であることから、試験体内部におけ る Z 方向の画像化範囲は 60mm となる。

4.2 母材 EDM ノッチを用いた特性調査

図2(b)に示すように、高さ4mm および2mmの ノッチが画像化範囲に入るように探触子を設置 し、母材部のノッチを探傷した。図3に、同じ素 子で送受信した際の128個の受信波形例を示す。 横軸に素子番号(CH)、縦軸に水の音速で計算し た探触子から伝搬した距離を、信号振幅値をカ ラーマップで表示している。縦軸に示す水距離 20mm 近傍に取得された波形が試験体表面から反 射した信号であり、試験体の表面Rに沿って、各 素子からの到達時間が変化していることが確認で きる。縦軸35mm 近傍の信号が試験体底面からの 反射波であり、画像化範囲は縦軸20~35mm 近傍 となる。なお、縦軸40mm 近傍の信号は、探触子 と試験体表面の間を2回反射して到達した信号と なる。

次に得られた波形データから、内部状況を画像



化した結果を図4に示す。画像は、縦軸に深さZ、 横軸に探触子長手方向X、カラーマップに画像振 幅値を示す。画像振幅値は底面反射を100%とし て規格化した値となる。図4(a)に一般的なTFM 法で計算した画像化結果を示す。一般的なTFM では、表面形状を画像化計算に反映させないた め、超音波の入射面である試験体表面を平面と仮 定する。したがって、平面でない試験体では、探 触子の中心以外は水から試験体へ超音波が入射す る位置・屈折角が曖昧になる。全体にRを有し、



図4 母材部付与 ノッチ画像化結果

溶接部の凹凸がある今回の試験体では、ノッチか らの反射は集束せず円弧上に広がり、底面からの 反射波も一部しか画像化できない。一方、図4(b) に示す ATFM 法の画像化結果では、試験体表面の 形状と、探触子の各素子と表面の距離を反映させ て画像化計算を行っているため、ノッチからの反 射は球状に画像化されている。底面反射に着目す ると、一般的な TFM 画像では画像化した範囲が およそ X:30 ~ 70mm だったが、ATFM 画像では X:20 ~ 80mm であった。

従来の UPA 法や TFM 法では、探触子表面の距離、探触子の傾き、試験体表面の R がわかってい ないと、超音波を集束することができない。ATFM 法では、これらを探傷時に自動で補正することか ら、フレキシブルウェッジのような、探触子を固 定できない探傷法や、表面形状が一様ではない試 験体に対して有効である。

4.3 余盛上からのノッチ検出性確認

試験体裏面のシーニング部に付与したノッチに 対して、余盛上から探傷した。

まず図5(a)に示すように、余盛の真上に探触 子を配置し、図1に示すノッチ③④を探傷した。 図5(b)に探傷結果を示す通り、余盛真上からの 探傷では、ノッチは検出できず、加えて底面エ コーもほとんど検出されなかった。

次に、図6(a)に示すように探触子位置を母材 側にずらし、溶接部と母材部の境界に探触子の中 心を設置してノッチ③④を探傷した。探傷結果を 図6(b)に示す。本位置における探傷では、ノッ チからの反射波が検出され、ノッチの画像化が実 現できている。

これらの結果より、余盛真上からの探傷では、 余盛表面の細かい凹凸が影響して超音波が試験体 表面で拡散してしまい、内部に入射できなかった が、探触子を母材側にずらすことにより、超音波 ビームの一部が凹凸のない母材表面から入射さ れ、ノッチに到達したと考えられる。したがって、 余盛上からの探傷で反射波が得られない場合は、 探触子を母材側にずらして走査することが有効で ある。

5. 接触式 ATFM 法の検討

5.1 探触子と治具

次に、探傷対象の形状に合わせて変化するフレ キシブルウェッジを用いて手走査における ATFM 法の性能を調査した。今回は図7に示すハロゲン フリー材質のゴムに水を注入して使用するタイプ

— 31 —



図5 水浸探傷 シーニング部ノッチ探傷結果(余盛真上)

図6 水浸探傷 シーニング部ノッチ探傷結果(母材側にシフト)

を採用した。

本タイプでは探触子から試験体表面までの主伝 搬体は水となるため、超音波探傷法の種類として は、「局部水浸探傷法」となる。使用した探触子は 図7(c)に示すように、探触子とフレキシブル ウェッジを合わせても片手で走査できる。探傷方 向は X 方向とした。

5.2 UPA 法との比較

母材部に付与した、高さ4mmのノッチ(図1(a)
②')を探傷した。探傷は糸引きのロータリーエン コーダを使用し、ノッチ真上よりX方向に±25mm を1mmピッチでラインスキャンした。ATFM法で 画像化した結果を図8(a)(b)(c)に、UPA法で画 像化した結果を図8(d) (e) (f) に示す。UPA 法に おける画像化方法は、FMC にて取得したデータを 用いて再構成した。この時、フォーカスの条件は 水距離 20mm、フォーカスポイントX:-25 ~ +25mm (1mm ピッチ)、Z:50mm とした。図中の 右方向がスキャン方向となり、図8(a) (d) はノッ チからX:-10mm 位置、図8(b) (e) はノッチ真 上、図8(c) (f) はノッチからX:+10mm 位置の結 果となる。横軸をX方向とし、横軸の0mm およ び赤点線はノッチ位置を示している。

ATFM 法の結果におけるノッチからの反射信号 (ノッチエコー)は、どの位置においても球状に集 束しており、位置精度が高い。加えて、底面エ コーも直線状に描写されている。一方、UPA 法に

(a) ウェッジ写真(上面)

(b) ウェッジ写真(側面)

(c) 探傷の様子

図8 母材部付与 4mm ノッチ

おけるノッチエコーは円弧状に発散している。特 に、図8(e)0mm位置では、反射信号が二つに分 離して描写されており、底面エコーも斜めになっ ている。加えて、位置精度も低く、ノッチエコー の位置は実際の位置より X 方向にずれている。こ れは、走査時にエンコーダの糸で引っ張られた探 触子が、フレキシブルウェッジの影響で傾きを 持って走査されていたことが原因と考えられる。 このように UPA 法はフレキシブルウェッジを用 いた探傷には不向きだが、ATFM 法は、探傷ごと に探触子の傾きを補正して画像化計算を行ってい るため、高い位置精度や集束性が得られる。

5.3 余盛上探傷

溶接部および溶接部近傍に付与した、高さ2mm のノッチ(図1に示すノッチ①、③)に対し、余盛 上から探傷した。4章の水浸探傷試験で余盛真上 からは超音波が試験体に入射されなかったことか ら、図9に示すように、探触子を母材側に5mm ず らして探傷した。

探傷結果を図10に示す。シーニング部に加工

図9 探傷の様子

したノッチ③の結果を図 10 (a) (b) (c) に、溶接 部に加工したノッチ①の結果を図 10 (d) (e) (f) に 示す。図中の右方向がスキャン方向となり、図 10 (a) (d) はノッチから -10mm 位置、図 10 (b) (e) はノッチ真上、図 10 (c) (f) はノッチ +10mm 位置 の結果である。各図の横軸は X 方向の位置であ り、横軸の 0mm および赤点線および赤丸はノッ チ位置を示している。

シーニング部の結果図 10 (a) (b) (c) は底面反 射が明瞭に描写されている。一方で、溶接部の結 果図 10 (d) (e) (f) では、底面反射が複数合成され ている。これは、探触子を母材側から溶接部に向 かって斜めに超音波を入射しているため、母材裏 面と溶接部の裏波からの反射が混合されたことに よる。

図 10 に示す通り、ノッチ①およびノッチ③い ずれの探傷結果においても、きず指示が球状に画 像化しており、きず位置も正確であった。このこ とから、余盛中心から探触子を母材側にずらすこ とにより、シーニング部、溶接部いずれでも高さ 2mmのノッチが検出可能であることを確認した。 ここで、今回の探傷で取得した波形から、水距

離(探触子と試験体表面との距離)と探触子の傾き の状態を計算した。水距離の計算結果を図11(a) に示す。横軸がX方向の走査位置を示し、0mmが ノッチ付与位置としている。縦軸は水距離を示し ている。グラフには、母材部4mmを探傷した際の 水距離の結果(図8)と、同様にノッチ①、ノッチ ③の結果を示している。走査距離50mm内におけ る水距離の変動は0.4mm程度であり、変動が少な い、すなわち、フレキシブルウェッジでも水距離 はほぼ一定に保たれることが確認できた。

次に、取得した波形より探触子から認識できる 表面形状を再現し、探触子と試験体表面の傾きを 計算した。探触子と試験体表面の傾きを入射角と し、式(1)に示す、スネルの法則より試験体に入 射される超音波の屈折角を求めた。

$\frac{\sin\theta_A}{=}$	V_A	(1)
$\sin \theta_{\scriptscriptstyle B}$	V_B	(1)

この時、入射角を θ_A 、屈折角を θ_B 、 V_A を水、 V_B を試験体の音速とした。

計算結果を図11(b)に示す。縦軸を屈折角、縦 軸の括弧内は入射角(探触子と試験体の傾き)を表 している。いずれの探傷でも探傷時の屈折角はお よそ20deg近く変動していることが確認できる。 今回は探傷できたが、検出目標のきず位置が深い と、屈折角で20deg変動した場合、探触子から発 生する超音波の主ビームが目標に到達しない可能 性がある。このことから、フレキシブルウェッジ を使用する場合、傾きをおさえることが重要であ る。

6. まとめと今後

本稿では、溶接線に対して直行方向に進展する きずの検出をするため、ATFM 法を用いた、溶接 部の余盛上からの超音波探傷を検討した。水浸探 傷法を用いた基礎的な検証試験より、表面が平面 でない対象に対する ATFM 法の有効性を確認でき た。しかし、溶接部余盛の中心から超音波を入射 した場合、余盛表面の細かい凹凸によって超音波 が試験体内部に入射されないことが判明した。こ の課題に関しては、余盛中心からわずかに(5mm 程度)母材側に探触子をずらすことにより、溶接 部のきず検出が可能であることが確認できた。

フレキシブルウェッジを用いた、手走査におけ る ATFM 法の検討では、走査方向に対して探触子 が傾く傾向にあった。しかし、ATFM 法の特性上、 探触子の傾きに対して、自動で位置情報が補正さ れるため、不安定な余盛上からの探傷においても、 超音波の集束性の高いきず検出が可能であった。 このことから、ATFM 法を用いれば、余盛上から シーニング部や溶接部に発生するきずの検出は可 能であると考える。実機適用のためには、探触子 の傾きを抑制するための治具開発が課題である。

図 11 走査時における探触子の状態

— 35 —

参考文献

- (1) 畠中宏明、長沼隼人、菅井孝郎、荒川敬弘、 柳原有紗、野瀬裕之、田上稔:高Cr鋼溶接部 クリープ損傷評価の信頼性向上に関する検 討、IIC REVIEW、No.47、2012/04、pp.25-30
- (2) 船戸一寛、芝田三郎:新UT (PhasedArray 法、 TOFD 法)技術の実機適用状況、IIC REVEIW、 No.41、2009/04、pp.17-23
- (3) 引地達矢、梶ヶ谷一郎、齋藤規子、中川博勝、 塩田佳紀:フェーズドアレイ法を用いた高クロ ム鋼溶接部の余寿命検査技術、IIC REVIEW、 No.57、2017/04、pp.12-17

- (4) M. Karaman, P.-C. Li, and M. O'Donnell : Synthetic aperture imaging for small scale systems, IEEE Transactions on Ultrasonic, Ferroelectrics and Frequency Control, Vol.42, No.3, 1995, pp.429-442
- (5) A. J. Hunter, B. W. Drinkwater and P. D. Wilcox : The wavenumber algorithm for full-matrix imaging using an ultrasonic array, IEEE Transactions on Ultrasonic, Ferroelectrics and Frequency Control, 55 (11), 2008, pp.2450-2462

元研究開発センター 研究開発 グループ (現株式会社 IHI イン フラ建設 鉄鋼事業部 鉄鋼管 理部 DX 開発グループ)

川崎 拓

TEL. 045-791-3522 FAX. 045-791-3547